

Thickness-Star FE 2.0

As small as a probe - layer thickness measuring made easy.

Application

The Thickness-Star FE 2.0 is a handy layer thickness gauge for precise and non-destructive measurement of copper layer thicknesses. Easy to operate with a single button and self-explanatory, multilingual menu navigation. It increases the certainty that the copper layer thickness to be processed is not too thin. This means that the cutting tools are not subject to unnecessary wear.

Your measurement data is now processed further by connecting to Android or iOS devices or a Windows PC via Bluetooth. The included free app allows you to manage your projects, assign measurement locations to photos and statistically analyze and graphically display the measurement results.



Features

- Measuring probe can be swivelled by 90°
- Robust light metal housing (IP64) protects against dust and spray water

Technical specifications

Measuring method:	magnetic induction on iron and steel	
Calibration value:	300 μm	
Resolution:	1 – 100 μm:	0.1 μm
	100 – 1000 μm:	1 μm
	> 1000 μm:	10 μm
Accuracy:	< 100 μm:	+/- 1 μm
	100 – 1000 μm:	+/- 1 %
	1000 – 2000 μm:	+/- 3 %
	> 2000 μm:	+/- 5 %

Interface:	Bluetooth Low Energy interface for communication with Android, iOS and Windows (nur TOP-CHECK Dual/Ferro)
Power supply:	1x 1.5 V AA Mignon (not included)
Scope of delivery:	calibration base plates/foils, operating instructions, handy case

How to order

Art. 605185 Thickness-Star FE 2.0

Thickness-Star FE 2.0

Klein wie eine Sonde - Schichtdicke messen einfach gemacht.

Anwendung

Das Thickness-Star FE 2.0 ist ein handliches Schichtdickmessgerät für präzise und zerstörungsfreie Messung von Kupferschichtdicken und mit einer einzigen Taste, sowie der selbsterklärenden, mehrsprachigen Menüführung einfach zu bedienen. Es erhöht die Sicherheit, dass die zu bearbeitende Kupferschichtdicke nicht unterschritten wird. Dadurch sind die Schneidplättchen keinem unnötigen Verschleiß ausgesetzt.

Die Weiterverarbeitung Ihrer Messdaten erfolgt neu durch Kommunikation mit Android- oder iOS-Geräten oder einem Windows-PC. Die dazugehörige, kostenlose App ermöglicht das Verwalten von Projekten, das Zuordnen von Messpunkten auf Fotos, sowie die statistische Analyse und grafische Darstellung der Messergebnisse.



Merkmale

- Messsonde schwenkbar um 90°
- Robustes Leichtmetallgehäuse (IP64) schützt vor Staub und Spritzwasser

Technische Spezifikationen

Messverfahren:	magnetinduktiv auf Eisen und Stahl	
Kalibrierwert:	300 μm	
Auflösung:	1 – 100 μm :	0.1 μm
	100 – 1000 μm :	1 μm
	> 1000 μm :	10 μm
Genauigkeit:	< 100 μm :	+/- 1 μm
	100 – 1000 μm :	+/- 1 %
	1000 – 2000 μm :	+/- 3 %
	> 2000 μm :	+/- 5 %

Schnittstelle:	Bluetooth Low Energy Schnittstelle zur Kommunikation mit Android, iOS und Windows (nur TOP-CHECK Dual/Ferro)
Stromverbrauch:	1 x 1.5V AA Mignon Batterie (nicht enthalten)
Lieferumfang:	Kalibrierinsel, Bedienungsanleitung, handlicher Koffer

Bestellnummern

Art. 605185 Thickness-Star FE 2.0

Daetwyler Graphics AG
Industriestrasse 17
CH-4665 Oftringen / Switzerland
Tel. +41 62 767 75 75
info@daetwyler-graphics.ch
www.daetwyler-graphics.com



A HELIOGRAPH HOLDING COMPANY